

特 許 協 力 条 約

PCT Rec'd PCT/PTO 24 JAN 2005

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
(PCT36条及びPCT規則70)

REC'D 07 OCT 2004

WIPO PCT

出願人又は代理人 の書類記号 H1810-01	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/09367	国際出願日 (日.月.年) 24.07.2003	優先日 (日.月.年) 24.07.2002
国際特許分類(IPC) Int. Cl. G02B 5/30, G02F 1/1335		
出願人(氏名又は名称) 日東電工株式会社		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 6 ページからなる。  
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で ページである。

- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
  - ☒ 国際予備審査報告の基礎
  - ☒ 優先権
  - ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
  - ☐ 発明の単一性の欠如
  - ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
  - ☐ ある種の引用文献
  - ☐ 国際出願の不備
  - ☒ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 26.12.2003	国際予備審査報告を作成した日 16.09.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 森 内 正 明	2 V 9 2 2 2
電話番号 03-3581-1101 内線 3269		

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## II. 優先権

1. ☐ この国際予備審査報告は、次の書類が所定の期間内に提出されなかったため、優先権の主張がされなかったものとして作成した。
- ☐ 優先権の主張の基礎となる先の出願の写し (PCT規則66.7(a))
- ☐ 優先権の主張の基礎となる先の出願の翻訳文 (PCT規則66.7(b))
2. ☐ この国際予備審査報告は、優先権の主張が無効であると認められるので、優先権の主張がされなかったものとして作成した。(PCT規則64.1)

したがって、この国際予備審査報告書においては、上記国際出願日を基準日とする

3. ☒ 追加の意見 (必要ならば)

この出願の優先権の基礎となる出願である、特願2002-215855の出願には、請求の範囲1に記載、マトリックス中に二色性物質を含有する偏光子であって、吸収を示さない測定波長において、面内位相差が950～1350nmの範囲である点については何ら開示がない。

したがって、この見解書によって示される新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解は、国際出願日を基準日として作成される。

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	2-3, 18	有 無
	請求の範囲	1, 4-17, 19	
進歩性(IS)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1-19	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-19	有 無
	請求の範囲		

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 10-268294 A (キヤノン株式会社) 1998.10.09、全文、全図、特に【0035】偏光板5、【0018】—【0020】、(ファミリーなし)  
 文献2: JP 2002-333522 A (日東電工株式会社) 2002.11.22、全文、全図、特に【0059】—【0060】比較例1、比較例2、(ファミリーなし)  
 文献3: JP 6-138319 A (株式会社クラレ) 1994.05.20、全文、全図  
 & JP 3342516 B2  
 文献4: JP 2002-28939 A (株式会社クラレ) 2002.01.29、全文、全図、特に【請求項1】、& JP 3422759 B2  
 文献5: EP 1153961 A2 (KURARAY CO., LTD.) 2001.11.14、全文、全図、特に claim 1  
 & JP 2002-28938 A、全文、全図  
 & US 2001/0039319 A1 & CN 1321703 A & KR 2001100955 A  
 文献6: JP 6-347641 A (株式会社クラレ) 1994.12.22、全文、全図、特に【0035】比較例1、比較例3、(ファミリーなし)  
 文献7: JP 2001-311826 A (日東電工株式会社) 2001.11.09、全文、全図、(ファミリーなし)  
 文献8: JP 2001-228333 A (住友化学工業株式会社) 2001.08.24、全文、全図 (ファミリーなし)  
 文献9: US 2001/0033349 A1 (Masaru HONDA et al.) 2001.10.25、全文、全図  
 & JP 2001-228332 A、全文、全図  
 & KR 2001062239 A & TW 509803 A

請求の範囲1、4乃至11、14乃至17、19について

文献1及び文献2には、マトリックス中に二色性物質を含有する偏光子が記載されている。

上記文献1及び文献2には、吸収を示さない測定波長において、面内位相差が950nm~1350nmの範囲にする点を直接的な記載は存在しない。

しかしながら、文献1及び文献2には、偏光子に用いられている材料、屈折率の数値、厚みからみて、前記範囲に該当する蓋然性が高い偏光子が記載されている。

したがって、請求の範囲1、4乃至11、14乃至17、19に記載の発明は、前記文献1及び文献2に対して新規性がないと考えられる。

請求の範囲2及び3について

請求の範囲2及び3では、偏光子の面内位相差のバラツキの程度として、微分変化量や、極大値と極小値との距離の程度や極大値と極小値との差の程度を種々特定している。

しかしながら、偏光子において、その面内位相差あるいはそれと同種の意味を持つ

## VIII. 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲1には、偏光子として、吸収を有しない測定波長において、面内位相差が950～1350nmの範囲内にある点を特定している。

しかしながら、前記吸収を有しない測定波長が、どのような値が不定、不明確であるので、それによって示される面内位相差の値の範囲が不定であり不明確である。よって、前記面内位相差によって規定される偏光子も明確でない。

請求の範囲2には、吸収を示さない測定波長において、面内位相差の微分位相差変化量の値の範囲を規定している。

しかしながら、前記吸収を有しない測定波長が、どのような値が不定、不明確であるので、それによって示される面内位相差の微分位相差変化量の値の範囲が不定であり不明確である。よって、前記面内位相差の微分位相差変化量によって規定される偏光子も明確でない。

請求の範囲3には、吸収を示さない測定波長において、面内位相差の極大値を示す部位と極小値を示す部位との距離が、10mm以下の範囲もしくは100mm以上の範囲であり、かつ、前記極大値と前記極小値との差（面内位相差のバラツキ）が60nm未満である点を規定している。

しかしながら、前記吸収を有しない測定波長が、どのような値が不定、不明確であるので、それによって示される面内位相差の極大値を示す部位と極小値を示す部位との距離の値の範囲及極大値と極小値との差の値の範囲が不定であり不明確である。よって、前記面内位相差の極大値を示す部位と極小値を示す部位との距離の値の範囲及極大値と極小値との差の値の範囲によって規定される偏光子も明確でない。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2. 欄の続き

パラメータの変化量、バラツキを低減する技術自体は、例えば、文献3乃至文献5に記載されているように従来周知の技術であり、また、それを規定する際の具体的な評価方法、測定方法や、それら評価方法や測定方法により規定される評価値、測定値の値をどのように設定するかは、当業者が設計上の要請や求める性能等に応じて適宜決定する事項にすぎない。

したがって、請求の範囲2及び3に記載の発明は、文献1及び文献2と文献3乃至文献5に記載の従来周知の技術の組み合わせにより進歩性を有さない。

請求の範囲12及び13について

偏光子を偏光変換素子や位相差フィルムと組み合わせる技術自体は周知慣用技術である。

また、偏光子を偏光変換素子や位相差フィルムと組み合わせる技術例として、文献2、文献7乃至文献9の記載も参照されたい。

請求の範囲18について

偏光子をエレクトロルミネッセンス表示装置に適用する技術は周知慣用技術である。

また、その技術例として文献7の記載も参照されたい。